

**Метрологія, стандартизація та  
підтвердження відповідності електронної апаратури**

**Алгоритми обробки  
результатів вимірювань**

## Загальні положення

Похибка результату вимірювання  $\Delta$  (у рамках класичного підходу!) є сумою:

$$\Delta = \Delta_c + \varepsilon,$$

де  $\Delta_c$  - систематична похибка;

$\varepsilon$  - випадкова похибка.

Формат предсталення результату вимірювання (у загальному випадку!) фізичної величини  $x$ :

$$x = A \pm \Delta,$$

де  $A$  - найімовірніше значення фізичної величини.

## Обробка результатів вимірювань при прямих одноразових вимірюваннях

При прямих одноразових вимірюваннях покази приладу  $A$  приймають за результат вимірювання, з максимальною абсолютною похибкою  $\Delta_{\max}$ , що визначається класом точності приладу.

Результат вимірювання записують у формі:

$$x = A \pm \Delta_{\max},$$

При цьому  $\Delta_{\max}$  містить як невідому систематичну, так і невідому випадкову похибки.

## Правила округлення похибки та результату вимірювання

1. Результат вимірювання округлюють до того ж десяткового знаку, яким закінчується округлене значення абсолютної похибки. Зайві цифри у цілих числах замінюють нулями. Якщо десятковий дріб у числовому значенні результату вимірювань закінчується нулями, то нулі відкидають до того розряду, який відповідає розряду числового значення похибки.

*Приклад.* Результат 4,0800, похибка 0,001; результат округлюють до 4,080.

2. Похибка результату вимірювання вказується двома значущими цифрами, якщо перша з них дорівнює 1 або 2, і однією  $2,7 \approx 3; 3,51 \approx 4; 5,5 \approx 6$ , якщо перша цифра дорівнює 3 чи більше (симетричний спосіб округлення).

*Приклад.*

## Правила округлення похибки та результату вимірювання

3. Округлення проводять лише в остаточній відповіді, а всі попередні розрахунки проводять з одним-двома зайвими знаками.

Якщо керуватися цими правилами округлення, то кількість значущих цифр у числовому значенні результату вимірювань дає можливість орієнтовно скласти враження про точність вимірювання. Це пов'язано з тим, що гранична похибка, обумовлена округленням, дорівнює половині одиниці останнього розряду числового значення результату вимірювання.

За технічних вимірювань можна застосовувати несиметричне округлення: якщо  $\Delta < 0,2$  - останній розряд не змінюють, якщо ж  $\Delta \geq 0,2$  - останній розряд округлюють до більшого значення.

*Приклад.*  $5,17 \approx 5$ ;  $5,21 \approx 6$ .

## Обробка результатів вимірювань при прямих багаторазових вимірюваннях

У цьому випадку загальний алгоритм є таким:

1) виконати попередню обробку вибірки  $x_i, i = \overline{1, n}$  (відкинути або якомога зменшити систематичні похибки), а також перевірити, чи відповідає вибірка нормальному законові розподілу; відкинути промахи;

2) обчислити межі невиключеної систематичної похибки (НСП)  $\Delta_c$ .

У найпростішому випадку визначити її граничні значення, виходячи з класу точності засобу вимірювань, вважаючи, що  $\Delta = \Delta_c$ .

3) найімовірнішим значенням результату вимірювань буде вибіркове середнє арифметичне

$$m_x = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i.$$

4) розрахувати середню квадратичну похибку результату вимірювання

$$\tilde{\sigma}_x = \frac{\sigma_x}{\sqrt{n}} = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - m_x)^2}{n(n-1)}},$$

де  $\sigma_x$  - середня квадратична похибка результату спостереження.

## Обробка результатів вимірювань при прямих багаторазових вимірюваннях

7) обчислити межі випадкової похибки результату вимірювання

$$\varepsilon = t_{\gamma}(n, p) \tilde{\sigma}_x,$$

де  $t_{\gamma}(n, p)$  - коефіцієнт Стюдента;

8) обчислити межі сумарної похибки результату вимірювання:

а) обчислити  $\Delta_c / \tilde{\sigma}_x$ ;

б) якщо:

$\frac{\Delta_c}{\tilde{\sigma}_x} < 0,8$  то  $\Delta \approx \varepsilon$  (нехтують систематичною похибкою);

$\frac{\Delta_c}{\tilde{\sigma}_x} < 0,8$  то  $\Delta \approx \Delta_c$  (нехтують випадковою похибкою);

$0,8 \leq \frac{\Delta_c}{\tilde{\sigma}_x} \leq 8$  то  $\Delta = kS_{\Sigma}$ .

Тут:

## Обробка результатів вимірювань при прямих багаторазових вимірюваннях

$$k = \frac{\varepsilon + \Delta_c}{\tilde{\sigma}_x + \sqrt{\sum_{i=1}^n \frac{\Delta_{c_i}^2}{3}}} = \frac{\varepsilon + \Delta_c}{\tilde{\sigma}_x + \frac{\Delta_c}{\sqrt{3}}}$$

- коефіцієнт, який залежить від співвідношення випадкової похибки та НСП

$$S_{\Sigma} = \sqrt{\sum_{i=1}^n \frac{\Delta_{c_i}^2}{3} + \tilde{\sigma}_x^2}$$

- сумарне середнє квадратичне відхилення результату вимірювання

7) результат вимірювань записати так:

$$x = m_x \pm \Delta; p,$$

де  $p$  – довірна імовірність.



## Спосіб виявлення промахів за нормального закону розподілу

Таким способом є порівняння абсолютної похибки (центрального відхилення) сумнівної варіанти  $x_i - m_x$  з максимальною похибкою  $3\sigma_x$ .

Якщо виконується нерівність:

$$x_i - m_x > 3\sigma_x,$$

то ця сумнівна варіанта є промахом, тобто цей результат потрібно відкинути. Основою цього способу є те, що імовірність появи значення, яке відрізняється від середнього арифметичного більше, ніж на  $3\sigma_x$ , дорівнює всього лише 0,003.

Доволі часто цей спосіб називають “**правило трьох сигм**”.

## Обробка результатів вимірювань при опосередкованих одноразових вимірюваннях

Дано функцію багатьох змінних

$$A = f(x_1, x_2, \dots, x_n),$$

аргументи якої вимірюють прямо одноразово, а похибки їхнього вимірювання

$\Delta x_i$  відомо. Тоді абсолютну похибку вимірювання  $A$  можна обчислити за виразом:

$$\Delta A \approx \sqrt{\sum_{i=1}^n \left( \frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 \Delta x_i^2} = \left[ D_i = \frac{\partial f}{\partial x_i} \Delta x_i \right] = \sqrt{\sum_{i=1}^n D_i^2},$$

$D_i$  - частинна похибка.

**Критерій незначних частинних похибок:** якщо серед двох частинних похибок одна відрізняється від іншої не менше, ніж утричі, то меншою з них можна знехтувати.

*Приклад використання цього критерію:* для перевірки вимірювальних приладів похибка зразкового приладу має бути принаймні утричі менша за похибку приладу, який повіряють.

## Обробка результатів вимірювань при опосередкованих багаторазових вимірюваннях

Відмінність від попереднього випадку та, що кожне  $x_i$  вимірюють багаторазово і, відповідно, розраховують для них  $m_{x_i}, \tilde{\sigma}_{x_i}$  :

$$\tilde{\sigma}_A = \sqrt{\sum_{i=1}^n \left( \frac{\partial f}{\partial x_i} \right)^2 \bigg|_{m_{x_i}} \tilde{\sigma}_{x_i}^2}.$$